



特許証
(CERTIFICATE OF PATENT)

特許第4827444号
(PATENT NUMBER)

発明の名称
(TITLE OF THE INVENTION)

結晶物質のX線回折データのMEM構造解析により静電ポテンシャルを実験的に求める方法

特許権者
(PATENTEE)

兵庫県佐用郡佐用町光都1丁目1番1号

財団法人高輝度光科学研究センター

発明者
(INVENTOR)

田中 宏志
高田 昌樹

出願番号
(APPLICATION NUMBER)

特願2005-184553

出願日
(FILING DATE)

平成17年 6月24日(June 24, 2005)

登録日
(REGISTRATION DATE)

平成23年 9月22日(September 22, 2011)

この発明は、特許するものと確定し、特許原簿に登録されたことを証する。
(THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE JAPAN PATENT OFFICE.)

平成23年 9月22日(September 22, 2011)

特許庁長官
(COMMISSIONER, JAPAN PATENT OFFICE)

岩井良行

